

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17776-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 05.02.2024

Ausstellungsdatum: 05.02.2024

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Excelitas Noblelight GmbH
Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau

mit dem Standort

Excelitas Noblelight GmbH
Messlabor
Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

Optische Messungen (Bestrahlungsstärke, Strahldichte, Strahlungsfluss)

Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17776-01-00

Fachbereich	Norm / Hausverfahren	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkungen
Optik	CIE 63 1984	The spectroradiometric measurement of light sources	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm
Optik	CIE 84 1989	The measurement of luminous flux	Lichtstrom und spektrale Strahlungsleistung 250-1100 nm
Optik	DIN EN 62471 2009-03	Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen (IEC 62471:2006, modifiziert); Deutsche Fassung EN 62471:2008	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm Strahldichte 250-1400 nm
Optik	IEC 62471 2006-07	Photobiological safety of lamps and lamp systems	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm Strahldichte 250-1400 nm
Optik	EN 62471 2008-09	Photobiological safety of lamps and lamp systems (IEC 62471:2006, modified)	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm Strahldichte 250-1400 nm
Optik	DIN EN 62471 Beiblatt 1 2010-06	Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen - Teil 2: Leitfaden für Herstelleranforderungen bezüglich der Strahlungssicherheit von optischen Quellen, die keine Laser sind (IEC/TR 62471-2:2009)	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm Strahldichte 250-1400 nm

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17776-01-00

Fachbereich	Norm / Hausverfahren	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkungen
Optik	DIN EN 14255-1 2005-06	Messung und Beurteilung von personenbezogenen Expositionen gegenüber inkohärenter optischer Strahlung - Teil 1: Von künstlichen Quellen am Arbeitsplatz emittierte ultraviolette Strahlung; Deutsche Fassung EN 14255-1:2005	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm Strahldichte 250-1400 nm
Optik	EN 14255-1 2005-03	Messung und Beurteilung von personenbezogenen Expositionen gegenüber inkohärenter optischer Strahlung - Teil 1: Von künstlichen Quellen am Arbeitsplatz emittierte ultraviolette Strahlung	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm Strahldichte 250-1400 nm
Optik	DIN EN 14255-2 2006-03	Messung und Beurteilung von personenbezogenen Expositionen gegenüber inkohärenter optischer Strahlung - Teil 2: Sichtbare und infrarote Strahlung künstlicher Quellen am Arbeitsplatz; Deutsche Fassung EN 14255-2:2005	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm Strahldichte 250-1400 nm
Optik	EN 14255-2 2005-12	Messung und Beurteilung von personenbezogenen Expositionen gegenüber inkohärenter optischer Strahlung - Teil 2: Sichtbare und infrarote Strahlung künstlicher Quellen am Arbeitsplatz	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm Strahldichte 250-1400 nm
Optik	DIN EN 14255-3 2017-02	Messung und Beurteilung von personenbezogenen Expositionen gegenüber inkohärenter optischer Strahlung - Teil 3: Von der Sonne emittierte UV-Strahlung; Deutsche Fassung EN 14255-3:2008	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm Strahldichte 250-1400 nm
Optik	EN 14255-3 2008-03	Messung und Beurteilung von personenbezogenen Expositionen gegenüber inkohärenter optischer Strahlung - Teil 3: Von der Sonne emittierte UV-Strahlung	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm Strahldichte 250-1400 nm

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17776-01-00

Fachbereich	Norm / Hausverfahren	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkungen
Optik	DIN EN 12198-1 2008-11	Sicherheit von Maschinen - Bewertung und Verminderung des Risikos der von Maschinen emittierten Strahlung - Teil 1: Allgemeine Leitsätze; Deutsche Fassung EN 12198-1:2000+A1:2008	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm Strahldichte 250-1400 nm
Optik	EN 12198-1 +A1 2008-09	Sicherheit von Maschinen - Bewertung und Verminderung des Risikos der von Maschinen emittierten Strahlung - Teil 1: Allgemeine Leitsätze	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm Strahldichte 250-1400 nm
Optik	DIN EN 12198-2 2008-11	Sicherheit von Maschinen - Bewertung und Verminderung des Risikos der von Maschinen emittierten Strahlung - Teil 2: Messverfahren für die Strahlenemission; Deutsche Fassung EN 12198-2:2002+A1:2008	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm Strahldichte 250-1400 nm
Optik	EN 12198-2 +A1 2008-09	Sicherheit von Maschinen - Bewertung und Verminderung des Risikos der von Maschinen emittierten Strahlung - Teil 2: Messverfahren für die Strahlenemission	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm Strahldichte 250-1400 nm
Optik	DIN EN 12198-3 2008-11	Sicherheit von Maschinen - Bewertung und Verminderung des Risikos der von Maschinen emittierten Strahlung - Teil 3: Verminderung der Strahlung durch Abschwächung oder Abschirmung; Deutsche Fassung EN 12198-3:2002+A1:2008	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm Strahldichte 250-1400 nm
Optik	EN 12198-3 +A1 2008-08	Sicherheit von Maschinen - Bewertung und Verminderung des Risikos der von Maschinen emittierten Strahlung - Teil 3: Verminderung der Strahlung durch Abschwächung oder Abschirmung	spektrale Bestrahlungsstärke 200-2500 nm Strahldichte 250-1400 nm

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17776-01-00

Fachbereich	Norm / Hausverfahren	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkungen
Optik	VAML12 2019-08	Messung Strahldichte	Strahldichte 250-1400 nm

Verwendete Abkürzungen:

- CIE Commission Interationale de l'Eclairage – Internationale Beleuchtungskommission
- DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
- EN Europäische Norm
- IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
- ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung